

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 4, 2019

Апериодические зеркала на основе бериллиевых многослойных систем <i>С. А. Гарахин, С. Ю. Зуев, Р. С. Плешков, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало</i>	3
Излучение рентгеновских квантов, нейтронов и заряженных частиц при рентгеновском облучении деитерированных кристаллических структур <i>О. Д. Далькаров, М. А. Негодаев, А. С. Русецкий, В. И. Цехош, Б. Ф. Ляхов, Е. И. Саунин, А. А. Болотоков, И. А. Кудряшов</i>	9
Исследование процессов карбидизации мезопористого кремния <i>А. С. Гусев, Н. И. Каргин, С. М. Рындя, Г. К. Сафаралиев, Н. В. Сиглова, А. О. Султанов, А. А. Тимофеев</i>	17
Моделирование свойств бета-вольтаических элементов на основе кремния и обогащенной пленки ^{63}Ni <i>М. А. Поликарпов, Е. Б. Якимов</i>	22
Описание зарядово-энергетического распределения быстрых ионов <i>Н. В. Новиков, Я. А. Теплова</i>	26
Описание потерь энергии тяжелых ионов в углероде в зависимости от их скорости <i>Ю. А. Белкова, Я. А. Теплова</i>	34
Послойный анализ тонкопленочных Si–O–Al-структур методами вторично-ионной масс-спектрометрии и резерфордского обратного рассеяния <i>В. И. Бачурин, Н. С. Мелесов, А. А. Мироненко, Е. О. Паршин, А. С. Рудый, С. Г. Симакин, А. Б. Чурилов</i>	38
Динамический отжиг ионно-индуцированных радиационных нарушений при повышенной температуре облучаемого алмаза <i>А. М. Борисов, В. А. Казак, Е. С. Машкова, М. А. Овчинников, Е. А. Питиримова</i>	44
Динамический потенциал взаимодействия нейтральных атомов с поверхностью кристалла <i>Е. В. Дергачева, В. С. Малышевский, Г. В. Фомин</i>	53
Изменение структуры осаждаемых углеродных пленок при электронном ассистировании <i>С. Н. Коршунов, А. М. Лебедев, Ю. В. Мартыненко, Н. Ю. Свечников, И. Д. Скорлупкин</i>	56
Ионно-трековая модификация пленки диоксида кремния, имплантированной цинком и отожженной в атмосфере кислорода <i>В. В. Привезенцев, А. Н. Палагушкин, В. А. Скуратов, В. С. Куликаускас, В. В. Затекин, А. В. Макунин, Д. А. Киселев, Э. А. Штейнман, А. Н. Терещенко</i>	65
Моделирование рассеяния частиц на аморфных и поликристаллических мишенях <i>Д. С. Мелузова, П. Ю. Бабенко, А. П. Шергин, А. Н. Зиновьев</i>	74
Моделирование влияния толщины диэлектрической пленки на поверхности катода на его эффективный коэффициент электронной эмиссии в слаботочном газовом разряде <i>В. И. Кристя, Мьо Ту Ха, М. Р. Фишер</i>	79
Разработка газового кластерного источника и его применение для обработки поверхности <i>В. О. Пеленович, Х. М. Zeng, А. Е. Иешкин, В. С. Черныш, А. Б. Толстогузов, В. Yang, D. J. Fu</i>	84
Влияние состава смазочной среды на структуру поверхностных слоев формирующейся при трении сервовитной пленки <i>В. Э. Бурлакова, Е. Г. Дроган, А. А. Новикова, М. А. Беликова</i>	91
Асимптотические формулы в теории дифракционного и переходного излучения на проводящей сфере <i>В. В. Сыщенко, Э. А. Ларикова</i>	100
Древние пергамены: диагностика структуры и визуализация фрагментов рукописного текста – естественно-научный подход <i>Е. А. Созонтов, А. А. Демкив, П. В. Гурьева, Г. С. Петерс, Н. Н. Колобылина, Е. В. Уханова, Е. Б. Яцишина</i>	108